



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号

西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20090727001

2009 年 8 月 18 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

営業・技術本部 カスタムドキュメント

マネージャ 牧 達郎 (牧)

TPS54350 製品 チップ一部改定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

記

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	☒ Design/Specification	☒ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Assembly	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐	-
変更内容	TPS54350 製品 チップ一部改定 現行：チップ一部改定未対応 変更後：チップ一部改定対応			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	8 月下旬の出荷より予定しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり		
備考	—			

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：今回のお知らせは、通知のみを目的としたものになります。
弊社 PWR (パワーマネジメント) TPS54350製品について、インダクタンス電流中の負スパイク電流発生是正の為に、対象製品のチップを一部改定し認定しました。本チップ改定によって、Voutを保持した状態(プレバイアス状態)でソフトスタート/イネーブルが切り替わる時に、インダクタンス電流中の負のスパイク電流発生を是正します。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容

チップ一部改定

現行

未対応

変更後

対応

理由：インダクタンス電流中の負スパイク電流発生是正の為

対象製品リスト

対象製品名				
HPA00164PWR	TPS54350PWP	TPS54350PWPG4	TPS54350PWR	TPS54350PWPRG4

製品表示

この変更に伴い、下記のように出荷ラベルに記載のチップレビジョンが” B” に変更されます。

	現行	変更
Chip Revision (2P): チップレビジョン	A	B



図1 出荷ラベルの例

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	TPS54350PWP	Die Size (mm):	2.192 X 2.054
Wafer Fab:	DFAB	Fab Process:	LBC4X
Die Protective Coating:	11.5KA CN		-
Assembly Site:	TAI	Package Type/Code/Pins:	HTSSOP/ PWP/16
Mount Compound:	Hitachi EN-4085S2K3	Mold Compound:	Shinetsu KMC 3580HB
Bond Wire:	1.98 Mil Dia. Cu	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL:	JEDEC LEVEL-2/260C		-

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails	Notes
ESD HBM	3 units/level, 2kV	3/0	-
ESD CDM	3 units/level, 500V	3/0	-
ESD MM	3 units/level, 100V	3/0	-
Electrical Char	Full temp & voltage range	Approved	-
Latch up	per JESD78	6/0	(1)
Manufacturability (Fab)	per Fab site spec	Approved	(1)
Yield Analysis	FT Yield and Bin summary	Approved	-

Notes: (1) TPS54350PWP Rev-A qual data has been utilized.